(7) 二次元 MEMS ミラーアレイデバイスの開発

加藤静一

1.背景と目的

近年の MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 技術の発達により、多数の微細なミラーを LSI 基板上 に製作し、個別に動作制御することが可能になってい る。このような二次元 MEMS ミラーアレイは空間変調器 として、プリンタ、ビデオプロジェクタ、マスクレス 露光機などへの応用が検討されている¹⁻³⁾。これらの応 用では、高解像度かつ高い階調性が求められ、さらに より高密度で高速のスイッチング速度が要求されてき ている。多くのミラー型空間変調器では、ねじり梁ヒ ンジという板バネで吊られたミラーを静電力や電磁力 で駆動する方式がよく用いられている。ビデオプロジ ェクタ用ミラーデバイスではフィルファクタを向上す るため、ミラー下にヒンジを形成する複雑な構造がと られている例 4)もある。ねじり梁ヒンジでミラーを支 持する構造では高解像度を得るためミラーサイズを縮 小すると、ねじり梁ヒンジの剛性が増加し駆動エネル ギーの増大を招く。

我々はねじり梁ヒンジを用いない新規構造の静電型 二次元ミラーアレイを開発したので報告する。このデ バイスは構造がシンプルで、バネ剛性による反発力が 生じないためミラーを小型化しても駆動力すなわち駆 動電圧が極端に増加しない。さらにヒンジを持たず傾 斜方向が一軸に制限されないため、傾斜の向きを自在 に選択でき二軸の光偏向が可能である。

2.デバイス構造

Fig.1 は開発した二次元ミラーアレイの概略図であ る。(a)はアレイ内の1ピクセルを、(b)は二次元アレ イを示している。電極を示すため、(a)においてはミラ ーの一部を、(b)においてはアレイ中央の二枚のミラー をそれぞれ取りさった。ミラーの各コーナー付近にポ 株式会社リコー研究開発本部東北研究所

ストおよびストッパが形成され、ミラー下にはピボッ トが設けられている。ミラーを支持するねじり梁ヒン ジは存在せず、ポストとストッパの作る空間でピボッ トを支点とし自由に傾斜できる。ミラーに対向しピボ ットを囲むように4つの電極が配置されており、これ らの電極からの静電誘導によりミラー電位が誘起され る。これにより電極とミラー間に静電力が発生しミラ ーを傾斜変位させることができる。傾斜したミラーと ストッパは非接触で、ミラーの偏向角はミラーサイズ とピボット高さからなる傾斜角により設計することが できる。



Fig.1 Schematic structure of device.

3.動作原理

Fig.2(a)と(b)に本デバイスの電極の構成とミ ラー偏向のための印加電圧例を示す。ミラーは電 極とミラー間の電位差による静電力で傾斜変位 する。ミラー電位 Vm は電極からミラーに静電誘 導で誘起され、次のように求めることができる。 電極 A, 電極 B, 電極 C, 電極 D とミラー間の静 電容量をそれぞれ Ca, Cb, Cc, Cd とすると本デ バイスの等価回路は Fig.2(c)のようになる。ミ ラーは電気的に浮いており各電極から誘導され る電荷の総和は零で、かつ各電極に対する電荷量 は 電荷量 = 静電容量 × (電極電位-ミラー電位) であるので、 Ca(Va-Vm)+Cb(Vb-Vm)+Cc(Vc-Vm) +Cd(Vd-Vm) = 0 となる。上式より、ミラーのフローティング電位 Vm は次式で示される。 Vm = (CaVa+CbVb+CcVc+CdVd)/(Ca+Cb+Cc+Cd) 各電極のミラーに対向する面積が同じであり、ミ ラーが電極 A, 電極 B 側と電極 C, 電極 D 側の間 で傾斜変位する場合、傾斜変位中の角度に関わら ず静電容量の関係は

Ca=Cb , Cc=Cd

である。





Fig.2 Operation principle.

Fig.2(a)では、電極 A, 電極 B, 電極 C, 電極 D の電位はそれぞれ、V, -V, 0, 0 に印加される。 Va=V, Vb=-V, Vc=0, Vd=0 であるので、ミラ 一電位 Vm は 0V となる。

このときミラーへの静電力は電極 A と電極 B に発生するが、電極 C と電極 D はミラーと同電位 であり静電力が生じない。この静電力でミラーは 電極 A, B 側に傾斜変位する。一方、Fig.2(b)で は、電極 A, 電極 B, 電極 C, 電極 D の電位はそ れぞれ、0,0,V,-V に印加され、ミラーの電位 は 0V となる。電極 A, 電極 B 側はミラーと同電 位で静電力は生じない。電極 C, 電極 D にはミラ ーと静電力が発生し、ミラーは電極 C, D 側に傾 斜変位する。さらに、4 電極の電位の組み合わせ により、前述のミラー変位と直交する方向への傾 斜変位させることも可能である。

4.動作シミュレーション

K. Jung らの報告 5)を基に下記(1),(2),(3) の仮定によって、本デバイスの動作を Fig.3 のよ うな簡単なモデルでシミュレーションを行うこ とができる。

(1) ミラーの傾斜による移動距離 d は、平行平板
 ミラーの(3/4) d から(1/4) d までの並進運動
 距離に等価である。

(2) 並進移動距離は m 個の微小距離(d,d/2 = m d)に分割できる。但し静電力は dの間一 定である。

(3) ミラーの質量 M による運動エネルギーが保存 される。

3.動作原理の項で述べたように電圧 V がミラ ーと電極間に印加される。

i 番目の微小距離における、静電力(Fi)、加速 度(ai)、速度(vi)、時間(ti)の関係は式(1),

(2),(3),(4)のように記述される。 。は真空中の誘電率、Aは1つの電極の面積を示す。ミラーの応答時間すなわち傾斜開始から完了までの時間は微小時間 tiの総和とすることができる。

$$Fi = \frac{1}{2}\varepsilon_0 (2A) \frac{V^2}{\frac{3}{4}d - \frac{i-1}{m}\Delta d}$$
(1)

$$a_i = \frac{F_i}{M} \tag{2}$$

$$v_i = \sqrt{\frac{2\left(\sum_{1}^{i} F_i \Delta d\right)}{M}}$$
(3)

$$t_i = \frac{v_i - v_{i-1}}{a_i} \tag{4}$$

この計算方法による時間に対するミラー変位 の様子を Fig.4 で示した。サイズ 20 µm×20 µm ×0.3 µm 厚、傾斜角 10°のミラーを 30V で駆動 した場合のシミュレーション結果である(以下、 ミラーサイズ20 µm角のものを 20 µmミラーと称 し、他のサイズも同様である)。

ミラー移動距離 d = 20 µm×sin10° = 3.47 µm を並進動作距離として 100 の微小距離に分割し た。ミラーに用いる AI 合金の密度 3200kg/m³か ら質量を M = 3.84×10⁻¹³kg、一つの電極面積 A = 90 µm²、真空中の誘電率 0=8.855×10⁻¹²F/m と した。ねじり梁ヒンジによる復元力が存在しない ので、傾斜変位の終わりに近づくに従い、曲線の 傾きすなわち速度が増加していることが分かる。 図に示すようにデバイスの応答時間(Response Time)は変位開始から終了までの時間とした。

Fig.5 はミラーサイズと印加電圧を変えた場 合のシミュレーションによる傾斜角 10°のミラ ーの応答時間を表している。ミラーサイズは 10 µm、15µm,20µmで,ピボット高さはそれぞれ 0.87µm,1.30µm,1.74µmであり、対応する電 極の面積はそれぞれ 18µm²,45µm²,90µm²であ る。ヒンジによる反発力や復元力がないため、応 答時間はミラーサイズと駆動電圧で決まり、ミラ ーサイズを小さくすると同じ応答時間を得る駆 動電圧を減少させることができる。



Fig.3 Model for mirror motion.



Fig.4 Numerically calculated displacement vs. time.



Fig.5 Estimation of response time of the device

5.デバイス試作

MEMS 二次元ミラーアレイでは駆動 LSI を製作 済みの基板上に表面マイクロマシン技術により マイクロメカニカル構造を形成する方法がよく 用いられる。従って、マイクロメカニカルな構造 を形成するプロセスはSi 半導体 CMOS プロセスに 整合性がよく、かつ製作済みの LSI に影響を与え ないプロセス温度で形成されることが必要であ る。 今回の報告では、デバイスの基本的な動作 評価をする目的で LSI 回路は形成せずに、二層メ タル配線を形成した後に二段階の犠牲層プロセ スにより MEMS ミラーアレイ構造を形成した。 Fig.6 にプロセスフローを示す。

(a) 第一メタルの AISiCu 膜が形成されたシリコン基板上にピボットを作製する。

(b) 2. デバイス構造の項で示した電極として TiN 膜をスパッタ法で成膜する。

(c) ピボットを完全に覆うように第一犠牲層の フォトレジストを塗布し平坦化する。

(d) ミラーとなる AI 合金をスパッタ法で第一犠 牲層の上に成膜する。

(e) さらに、第二犠牲層であるフォトレジストを 塗布し平坦化する。

(f) 第二犠牲層のミラーのコーナー付近にポストとなる孔を開け、酸化膜を成膜し、孔を埋める。(g) 最後に犠牲層を酸素プラズマでアッシング除去する。



同一基板上に形成した 3 種類のミラーサイズ のデバイス(a)20µm ミラー、(b)15µm ミラー、 (c)10µm ミラーの SEM 像を Fig.7 に示す。ポス トの直径を1.2µm、ストッパの直径を4µmにし た。ピボット高さは 0.8 µm であり、10 µm,15 µ m,20µm ミラーの傾斜角はそれぞれ 9.2°,6.1° , 4.6°である。各サイズともミラー表面が平坦 に得られ、試作プロセスがミラーデバイス形成に 適していることが分かった。ポストとストッパの 拡大写真を(d)に示す。ミラーが傾斜変位動作中 にはポストだけでなくストッパにも接すること があり、ストッパにより4本のポストが繋がり機 械的な強度を確保しつつ、ミラーとポストやスト ッパとの接触面積が小さくなる構造が得られて いる。ミラーがポストやストッパに接触するとき 発生する機械的な抵抗力はミラーの応答特性を 悪くするので接触面積を小さくする構造が重要 であり、本デバイス構造ではそれを実現すること が出来ている。

6.評価結果および考察

ミラーの動作はレーザドップラー振動計(グラ フテック社製 AT7212) で評価した。測定は環境 湿度変動の影響を除くため、2300Paの減圧雰囲 気と大気圧の乾燥窒素雰囲気で行った。Fig.8 に 15µm ミラーと20µm ミラーを25V で駆動した場 合の傾斜変位の応答特性をシミュレーション結 果と共に示した。減圧雰囲気ではシミュレーショ ンと測定結果が、残留振動成分を除き良く合って いることが分かる。窒素雰囲気では傾斜変位が遅 くなっており、窒素のような粘性気体を押しつぶ す時に発生するスクィーズフィルムダンピング (squeeze film damping)⁶⁾がミラーの傾斜動作 に影響したためと考えられる。また、傾斜変位後 に数 µ sec 間の残留した振動が見られる。減圧雰 囲気より窒素雰囲気で振動が小さいのは雰囲気 の粘性抵抗による減衰が大きいためと考えられ る。



(a) 20 µ m



(b) 15 µ m



(c) 10 µ m



(d) post and stopper

Fig.7 The fabricated two-dimensional mirror array device.

但し、この残留振動波形にはレーザドップラー 振動計の測定周波数の制限に起因する電気的に 発生した振動波形も含まれており、今後詳細な解 析が必要である。残留振動を含む波形では傾斜変 位開始から傾斜を完了する変位値に達するまでの時間を応答時間(Response time)とした。



Fig.8 Time response of the device.

Fig.9に15µmと20µmミラーの駆動電圧に対 する応答時間を示した。応答時間を 2300Pa の減 圧雰囲気と大気圧の乾燥窒素雰囲気で測定し、シ ミュレーション結果との比較を行った。15µmミ ラーと 20µm ミラーともに減圧雰囲気の応答時 間はシミュレーションと良く一致しているが、窒 素雰囲気の応答時間は遅くなっていることが分 かる。これは前述のような気体の抵抗がミラーの 傾斜動作を妨げているためと考えられる。窒素雰 囲気でも駆動電圧が大きくなると駆動トルクも 増加するため、シミュレーションや減圧雰囲気で の応答時間と差が少なくなっている。15V未満の 駆動電圧ではミラーが動作せず、また、40Vを超 えての駆動電圧では第一メタルと第二メタル間 でショートが発生したため、測定の範囲を 15V から 40 とした。ミラーと接する部材との間にフ ァンデアワールス力などに起因する固着力

(stiction force)^{7),8)}が存在しているために、 15V より低電圧での静電力ではミラーを動作さ せることができなかったと思われる。



Fig.9 Response time against driving voltage.

7.結論

ねじり梁ヒンジを用いない新構造静電駆動二次 元ミラーアレイの開発を行った。簡単なシミュレ ーションにより、ミラーの応答時間を見積もるこ とができた。二層メタルの表面マイクロマシニン グプロセスを用いミラーデバイスを製作し、応答 特性を評価することができた。15 µm ミラーと 20 µm ミラーの応答時間は減圧雰囲気でシミュレ ーションと良く一致したが、窒素雰囲気では窒素 の粘性抵抗により遅くなった。駆動電圧が 15V 未満では動作せず、ミラー接触部に固着力が作用 しているものと考えられる。

8. 今後の展開

高密度化のためさらに微細なミラーのプロセス開発 を行う。また、LSI 制御回路基板上に二次元マイクロ ミラーアレイを一貫して製作し、個別ミラーの駆動お よび制御方法を開発する。

参考文献

1) W. E. Nelson and R. L.Bhuva, :Digital Micromirror Device Imaging Bar Hardcopy, Color Hard Copy and Graphic Arts IV, J. Bares (ed.), Proc. SPIE Vol. 2413, (1995), pp.58-65.

2) H. Urey and D. L. Dickensheets: Display and Imaging systems, M. E. Motamedi (ed.), MOEMS, Bellingham, WA: SPIE Press, (2005).

3) G. P. Watson et al. : Spatial light modulator for maskless optical projection lithography, J. Vac. Sci. Technol., B24(6), Nov/Dec, (2006).

4) J. T. Tsai and M. C. Wu: Gimbal-Less MEMS Two-Axis Optical Scanner Array With High Fill-Factor, J. of Microelectromechanical Systems, vol. 14, No. 6, Dec., (2005),pp.1323-1328.

5) K. Jung et al.: Numerical analyses of micromirror for projection TV using FEM, Microsystem Technologies, vol7, (2001), pp.75-79.

6) F. Pan et al. : Squeeze Film Damping Effect on Dynamic Response of a MEMS Torsion Mirror, J.
Micromech. Microeng. 8, (1998), pp. 200-208
7)S. A. Henck: Lubrication of digital micromirror devices[™], Tribology Letters, vol.3, (1997), pp.239-247.

8) B.Bhushan and H. Liu: Characterization of nanomechaniccal and nanotribological properties of digital micromirror devices Nanotechnology, vol.15, (2004), pp.1785-1791.

禁無断転載

2007 年度

ビジネス機器関連技術調査報告書(" 3"部)

発行 社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 技術委員会 技術調査小委員会

〒105-0003 東京都港区西新橋 3-25-33

NP 御成門ビル 4F

電話 03-5472-1101

FAX 03-5472-2511